

JW3308 插回损仪



产品特点

1. 多种功能测试模式（RL、IL、OPM、OLS）；
2. 测试数据有存储上传功能；
3. 支持USB供电功能；
4. 界面简单，易于操作；

产品概述

JW3308光回损仪设计用于测量各种光器件、光链路的反射衰耗，控制光纤接头质量，是应用于现场的最优化解决方案。可分别用做光回损测试仪、插损测量仪、光功率计、光源，并具有数据储存功能。

技术指标

规格型号	JW3308
光回损测试	
测试波长 (nm)	1310/1550 (±20)
谱宽 (nm)	<5
输出功率 (dBm)	≥-5
稳定度 (dB/30min) *2	±0.05
测量范围 (dB)	0~70
精度 (dB) *3	±0.5
分辨率 (dB)	0.01
接口类型	FC/APC
光插损（功率计）模式	
波长范围 (nm)	800 ~ 1700
校准波长 (nm)	850/1300/1310/1490/1550/1625
显示单位	DBm、dB、xW
测量范围 (dBm)	+6~-70
不确定度 (dB) *4	±0.25
显示屏	LCD
通讯接口	USB
电源 (V)	3节1.5V AA电池/USB供电
工作温度 (℃)	-10~+60
存储温度 (℃)	-25~+70
相对湿度	0~85% (不冷凝)
外观尺寸 (mm)	180*90*36.5
重量 (g, 不含护套、电池)	380

备注：

1. 以上技术指标均在T=23±2℃测试。
2. 需开机预热15分钟后测试。
3. 回损在0~60dB时测试。
4. 在λ=1310nm，输入功率在+6~-50dBm时测试。